

TDX - ATG テストベクタ自動生成

TDX-ATG はフルスキャン、パーシャルスキャン、ノンスキャン設計に使用できるゲートレベル、順序テストベクタ自動生成プログラムです。同期 / 非同期回路、RAM 内蔵回路、双方向ポート、複雑なバスなどのベクタを生成可能です。ユーザーがソフトウェアのコントロールを取って特定のフォルトに活性化を与えるために回路を望ましい内部状態に持ち込むインタラクティブモードをサポートしています。

アルゴリズムと Heuristic Based

- ・様々なアルゴリズムとヒュリスティックのネットリストを解析するために使用
- ・コンビネーション回路は PODEM か D アルゴリズムモードで動作
- ・スキャンベーステストの為のベクタ生成時に広範囲で使用
- ・スキャンベクタや順序回路モジュールを生成時にランダムベクタ生成モードを使用可能
- ・順序回路にはプロプリタリフォワードサーチングヒュリスティック、広範囲なバックトレース方法を使用、テストピリティ解析数はステートジャスティフィケーション / センシティゼーションのサーチ

TDX-FSIM との併用、ベクタフォーマット

- ・TDX-FSIM と併用でき FSIM 固有のベクタフォーマットとパーピン/ATE 能力を含む
- ・タイミングは双方向ピンを含む入出力ピンで強制でき、衝突を明確に分析しテスターによって入出力ピンがストロブ時に故障が明確になるになるベクタを生成
- ・ベクタが双方向ピンで衝突を起こした場合には生成したベクタを消去可能

TDX - STEP、IDDQ との併用による効果

- ・順序回路で動作時は同期回路で動作、ゲートクロックを含む回路や非同期回路でも動作
- ・ネットリストをベースとする全てのテストパターン自動生成、DFT 促進による修正、複雑な順序を減らす為に設計された同期回路、同期回路に近い順序回路上で動作
- ・特許申請中の TDX-STEP 技術は順序回路の可制御性と可観測性の促進に効果
- ・ユーザーと TDX-STEP の両方から DFT 提案を受入
- ・テストポイントのための提案、及びフリップフロップはパーチャルインサート可能
- ・what if モードは最終的な DFT 改善が行われるまで全ての設計サイクルを往来可能

インタラクティブモード

- ・結果判断と ATG の結果に影響するような洞察力を与える
- ・パステストなどに使用する場合 TDX-ATG の結果改善に有効、テスト容易化設計の短縮

株式会社アイヴィス

〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク イー・ストワ- 11F
TEL:(045)332-5381(代) FAX:(045)332-5391 email: info@ i-vis.co.jp

